ÜBERSTRUKTUR IN

Physikalisches Praktikum B am 2. physiklaieschen Institut

26.01.2015



Studenten Betreuer

Ramin Karbalaie Yushi Nishida Pavlo Ignatiev

Abbildungsverzeichnis

	1	Beugung an Gitterebenen eines Festkrpers (Quelle: Wiki)	3						
	2	Debye-Scherrer-Verfahren (Quelle: Spektrum)	5						
I	nha	ltsverzeichnis							
1	The	eoretische Grundlagen	2						
	1.1	1 Aufbau von wichtigsten Überstrukturen in CuZn, CuAu, Cu ₃ Au							
		1.1.1 CuZn	2						
		1.1.2 CuAu	2						
		1.1.3 Cu ₃ Au	2						
	1.2	Ordnungsparameter und Phasenübergang	2						
	1.3	Beschreibung von periodischen Strukturen	2						
	1.4	Entstehung von Röntgenstrahlung	2						
		1.4.1 Bremsstrahlung	2						
		1.4.2 Charakteristische Rntgenstrahlung	3						
	1.5	Strukturanalyse mittels Röntgendiffraktion	3						
	1.6	Intensiter gestreuten Rntgenstrahlung	5						
	1.7	Drude-Theorie und die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes	8						
2	Aus	swertung	8						
	2.1	Das röntgenmetrische Verfahren	8						
	2.2	Das resistive Verfahren	10						

1 Theoretische Grundlagen

1.1 Aufbau von wichtigsten Überstrukturen in CuZn, CuAu, Cu₃Au

1.1.1 CuZn

Messing mit einen 50/50 Kupfer/Zink verhältnis bestehen aus einer sc-Struktur vom Kupfer und Zink. Sie sind so geordnet, guckt man sich z.b. einen Kupfer Atom an sind 8 Zink Atome wie in einer bcc-Struktur um das Kuopfer Atom verteilt und genauso für Zink nur dass sie vom Kupfer Atome umgeben sind.

- 1.1.2 CuAu
- 1.1.3 Cu₃Au
- 1.2 Ordnungsparameter und Phasenübergang
- 1.3 Beschreibung von periodischen Strukturen

1.4 Entstehung von Röntgenstrahlung

Als R
ntgenstrahlung bezeichnen wir elektromagnetische Wellen mit Energien zwischen 5 und einigen hundert keV, welche den Wellen
len im Bereich 1 – 250 pm bzw. den Frequenzen im Bereich von 0,25 – 60 Ehz entsprechen. Im elektromagnetischen Spektrum liegen R
ntgenstrahlen zwischen dem ultravioletten Licht und der γ -Strahlung.

Zwei grundsliche Arten der Rntgenstrahlung sind Bremsstrahlung und charakteristische Strahlung eines Atoms.

1.4.1 Bremsstrahlung

Bremsstrahlung ist eine lektromagnetische Strahlung, welche durch beschleunigte Ladungstrr emittiert wird und sich durch ein kontinuierliches Spektrum auszeichnet. Die Bremsstrahlung It sich z. B. in einer Rntgenrhre erzeugen, indem eine Glhwendel Elektronen emittiert und diese dann durch eine Spannung beschleunigt werden. Beschleunigte Elektronen werden an einer Anode (z. B. Wolfram) abgebremst und emittierren dabei Energie in Form von Strahlung. Die emittierte Strahlung maximal die gesamte kinetische Energie des Elektrons mitnehmen. Wie knnen somit die kurzwellige Grenze des Spektrums fr die angelegte Spannung U bestimmen:

$$\lambda_{min} = \frac{h \cdot c}{e \cdot U} \tag{1}$$

1.4.2 Charakteristische Rntgenstrahlung

Fr ein Atom charakteristische Rntgenstrahlung, welche beim ergang zwischen Elektronenhllen emittiert wird. Dieser Strahlungsart entsprechen scharfe Linien im Spektrum, welche einzelne erge zwischen atomaren Energieniveaus charakterisieren. Um diese Strahlung zu erzeugen, wird zunst ein Elektron an einem Atom gestreut. Das Elektron muss ausreichend Energie besitzen, um ein Elektron der blicherweise inneren Schale des Atoms herauszuschlagen, mindestens soll jedoch die Energie ausreichen, um das Schalen-Elektron in eine hherenergetische Schale zu befrdern. Verlt ein atomares Elektron seine Schale (z. B. K – Schale), so wird die entstehende Lcke durch ein Elektron aus einer hherenergetischen Schale (z. B. L – Schale) gefllt. Die Differenz zwischen den Schalenenergien betr typischerweise $1-100~{\rm keV}$ und wird als Rntgenstrahlung emittiert. Da die atomaren Energieniveaus diskret sind, sind auch die emittierten Energien diskret, was wir im Spektrum als scharfe Peaks beobachten.

1.5 Strukturanalyse mittels Röntgendiffraktion

Geordnete Strukturen lassen sich mittels der Beugung von R
ntgenstrahlen an ihrem Gitter auflsen. Die Wellenle der einfallenden Strahlung muss von der Gr
nordnung des atomaren Abstandes sein, damit die Beugung auftritt. R
ntgenstrahlen eignen sich dafr besonders gut, weil ihre Wellenle gerade dem Atomabstand von der Gr
nordnung 1 Å entspricht.

Die einfallende Strahlung wird an der Elektronenhlle der Gitteratome gebeugt, die gebeugten Wellen knnen miteinander interferieren und man beobachtet ein materialspezifisches Interferenzbild. Beugung an verschiedenen Gitterebenen im Abstand d zeichnet sich durch einen Gangunterschied $\Delta s = 2d \cdot sin(\Theta)$ aus. Fr eine konstruktive Interferenz muss der Gangunterschied ein vielfaches der Wellenle sein: $\Delta s = n \cdot \lambda$. Somit erhalten wir die Bragg-Bedingung fr Beugung an den Netzebenen eines Kristalls:

$$n\lambda = 2d \cdot \sin(\Theta) \tag{2}$$

Hier bezeichnet Θ den Einfallswinkel der Strahlung relativ zu einer Netzebene, wie aus der Abb. 2 ersichtlich. Fr jede Netzebenenschar ist ein Beugungswinkel charakteristisch. Ist die Wellenle der Rntgenstrahlung bekannt, so lt sich aus der Bragg-Gleichung der Netzebenenabstand d_{hkl} bestimmen.

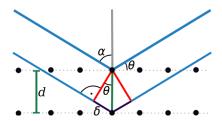


Abb. 1: Beugung an Gitterebenen eines Festkrpers (Quelle: Wiki)

Alternativ lt sich die Beugung am Kristall durch ein Laue-Modell beschreiben: Eine konstruktive Interferenz der Rntgenstrahlung wird demnach erreicht, wenn die Differenz der Wellenvektoren der einfallenden und der gebeugten Strahlung gerade einem reziproken Gittervektor entspricht:

$$G = k' - k \tag{3}$$

Fr ein sc-Gitter k
nnen wir den Zusammenhang zwischen dem Gitterabstand d und der Gitter
konstante a wie folgt formulieren:

$$d = \frac{a}{\sqrt{h+k+l}} \tag{4}$$

Einsetzen dieser Relation in (2) ergibt

$$\frac{\sin(\Theta)}{\lambda} = \frac{h+k+l}{4a} \tag{5}$$

Hierbei haben wir den Faktor n in die Millerschen Indizes aufgenommen. An diesem Zusammenhang sehen wir, dass der Beugungswinkel von der Gr und der Form der Bravais-Einheitszelle abht. Um die Struktur des Kristalls zu untersuchen, knnen wir nun den Streuwinkel oder die Wellenle variieren. Es existieren verschiedene Methoden der Kristallographie; Debye-Scherrer-Methode ist eine von ihnen und wird in diesem Versuch verwendet.

Debye-Scherrer-Methode

Diese Methode ist eine Pulvermethode, d. h. der zu untersuchende Krper liegt nicht als Einkristall, sondern als polykristallines Pulver vor. Hier wird der Beugungswinkel variiert und die Wellenle der Rntgenstrahlung fest eingestellt. Da die Probe als Pulver vorliegt, ist fr ein Experiment nur eine geringe Menge des Materials ntig. Dies ist ein Vorteil gegenber der Bragg-Methode, mit welcher bestimmte Netzebenen eines Einkristalls durch Drehung untersucht werden knnen. Die witzigen Kristalle des Pulvers lassen es dagegen zu, praktisch alle mglichen Netzebenen abzutasten. Aurdem ist diese Methode gegenber der Methode von Laue vorteilhaft, weil eine Variierung der Wellenle der Rntgenstrahlung sehr aufwendig ist.

Um die Wahrscheinlichkeit eines Bragg-Reflexes zu erhhen, wird das Kristallpulver bei der Debye-Scherrer-Methode zuslich in zylindrische Form gebracht und wend der Bestrahlung gedreht. Damit das Spektrum eindeutig zu interpretieren ist, wird die Rntgen-Strahlung mglichst monochromatisch gehalten.

Die einfallende Strahlung wird durch das Pulver in alle Raumrichtungen gestreut. Ein Proportionalzrohr ft alle Streuwinkel 2Θ ab (vgl. Abb. 2) und nimmt dadurch die Intensitn der gebeugten Rntgenstrahlen auf.

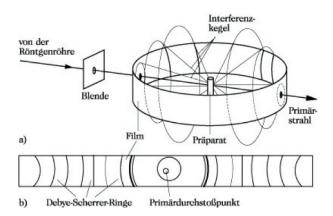


Abb. 2: Debye-Scherrer-Verfahren (Quelle: Spektrum)

1.6 Intensiter gestreuten Rntgenstrahlung

Wir haben festgestellt, dass der Beugungswinkel nur von der Gr und der Form der Einheitszelle abht. Der Ordnungsgrad s der Probe hat aber immer noch Einfluss auf die Intensiter gebeugten Strahlung. Durch Messung der Intensitn lt sich umgekehrt der Ordnungsgrad der Probe bestimmen.

Die Intensitetzt sich aus verschiedenen winkelabhigen Faktoren zusammen:

$$I_{hkl} \propto |F|pL_PA_T$$
 (6)

Atomformfaktor

Fr Untersuchung der Beugung war es irrelevant, ob die Ausdehnung der Streuzentren von der eines geometrischen Punktes abweicht. Die Ausdehnung eines Atoms ist jedoch gegenber der Strahlungswellenle nicht zu vernachligen - Streuung der Rntgenstrahlung erfolgt nicht an Kernen, sondern an Elektronenhllen. Dies fhrt zu einer Phasenverschiebung gegenber den tatslichen Gitterplen, sodass die Intensitn kleiner erscheinen, als es bei einem punktartigen Streuzentrum mglich w. Fr jede Atomsorte kann man ein Mar die Verkleinerung der Intensitls Atomformfaktor ausdreken:

$$f_i = \frac{\text{Amplitude der am i-ten Atom gebeugten Welle}}{\text{Amplitude der einfallenden Welle}}$$
 (7)

Strukturfaktor

Die obige Bragg-Bedingung soll korrigiert werden, wenn statt eines monoatomaren Gitters ein Gitter mit mehratomiger Basis vorliegt: Die Basisatome stellen weitere Streuzentren der Strahlung dar. Streuung an verschiedenen Basisatome resultiert in verschiedenen Phasenverschiebungen bzgl. der einfallenden Strahlung. Wir wollen nun einen Ausdruck fr den Strukturfaktor in Abhigkeit von Millerschen Indizes ableiten.

Betrachten wir eine Basis aus n Atomen mit Atomformfaktoren f_j . Lassen wir den ersten Atom mit dem Formfaktor f_1 genau auf dem Bravaisgitterpunkt sitzen, so setzt sich der Formfaktor der Basis aus folgenden Termen zusammen:

$$F_{hkl} = f_1 + \sum_{j=2}^{n} f_j \cdot e^{i\phi_j}$$
 (8)

 ϕ_j bedeutet hier die Phasenverschiebung der gebeugten Welle am j-ten Atom gegenber der Bravaisgitterpunkt. Die Phasenverschiedung ist mit dem Gangunterschied ber die Relation $\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta s$ verbunden. Setzen wir hier den Ausdruck fr den Gangunterschied und benutzen wir die Bragg-Gleichung unter der Annahme der 1. Beugungsordnung (n=1), so ergibt sich fr eine Phasenverschiebung zwischen Nachbargitterpunkten

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta s = \frac{2\pi}{\lambda} 2d \cdot \sin(\Theta) = \frac{4\pi}{\lambda} \cdot \frac{n\lambda}{2} = 2\pi \tag{9}$$

Wir wollen nun die Phasenverschiebungen der Basisatome mit ihren Koordinaten innerhalb des Gitters verbinden. Diese Koordinaten sind mit den Gitterkonstanten ber $x'_j = x_j \cdot a, y'_j = y_j \cdot b, z'_j = z_j \cdot c$ verknpft. Dabei sind x_j usw. Koordinaten der Basisatome in Einheiten der Gitterkonstanten. Nun bercksichtigen wir Folgendes: Eine Ebenenschar mit Millerschen Indizes hkl teilt a in h, b in k und c in l gleiche Abschnitte ein. Wir bekommen dementsprechend

$$\frac{\phi_j(x)}{2\pi} = \frac{x_j \cdot a}{\frac{a}{h}} \Rightarrow \phi_j(x) = 2\pi \cdot h \cdot x_j \tag{10}$$

Das gleiche gilt fr $\phi_j(y)$ und $\phi_j(z)$, sodass der Strukturfaktor schlieich lautet

$$F_{hkl} = f_1 + \sum_{j=2}^{n} f_j \cdot e^{2\pi i \cdot (hx_j + ky_j + lz_j)}$$
(11)

Dieser Faktor ist komplex und geht in die Amplitude der gebeugten Welle ein, sodass die Intensiten Faktor $|F_{hkl}|^2$ beinhaltet.

Flenhigkeitsfaktor

Mit diesem Faktor k
nnen wir bzgl. der Bragg-Reflexion gleichwertige Ebenen bercksichtigen. Z. B. gibt es in einem sc
-Gitter 6 geometrisch verschiedene 100-Ebenen, jeweils 2 davon sind jedoch parallel und gehren also zu einer Ebenenschar. Somit gibt es insgesamt nur p=3 100-Ebenenscharen, welche bzgl. der Bragg-Reflexion ivalent sind, weshalb die 100-Reflexe eine Verdreifachung in ihrer Intensitufweisen. p ist dementsprechend ein Flenhigkeitsfaktor.

Lorentz-Polarisationsfaktor

Die einfallende Rntgenstrahlung ist transversal polarisiert, daher emittieren die angeregten Elektronen schwer in die Richtung senkrecht zur Einfallsrichtung, als in die Lsrichtung. Die Intensiter gebeugten Welle weist i. A. folgende Abhigkeit von dem Beugungswinkel auf:

$$I \propto 1 + \cos^2(2\Theta) \tag{12}$$

Genau gesehen sind die Streuwinkel nicht exakt, sondern zeigen eine Aufweitung. Diese Aufweitung resultiert sich in einer Unsche der mit dem Detektor aufgenommenen Linien, sodass sich die ursprngliche Intensituf eine Fle verteilt, welche von der Spektralbreite der einfallenden Strahlung, der Detektorauflsung, den Rotationseffekten der Anordnung abht. Diese Effekte sowie die Polarisation werden im Lorentz-Polarisationsfaktor zusammengefasst:

$$L_P = \frac{1 + \cos^2(2\Theta)}{\sin^2(\Theta) \cdot \cos(\Theta)} \tag{13}$$

Thermische und Absorptionseffekte

Thermische Bewegung der Atome verursacht eine Schwingung um die Gitterple, welche zu der Linienunsche des aufgenommenen Spektrums beitr. Insbesondere bei kleinen Netzebenenabsten spielt diese Schwingung eine zunehmende Rolle.

Eine Absorption der einfallenden Strahlung im Inneren des Krpers findet immer statt, Strahlungsenergie wird dabei in We umgesetzt. Die Absorption verringert die Intensiter gebeugten Strahlung mit steigendem Strahlenweg durch das Material. Die beiden Faktoren werden im Faktor A_T zusammengefasst.

1.7 Drude-Theorie und die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes

Die Druide Theorie beschreibt den Ladungstransport der Elektronen im Matallen durch einen elektrischen Feld. Die Elektronen stoßen während des Transports mit Gitterinonen und werden abgebremst. Die mittlere Stoßzeit der Stöße entscheidet ueber die Leitungsfähigkeit der Metalle. Wird die Temperatur erhöht so schwingen die Gitterionen stärker und kollidieren häufiger mit den Elektronen. Somit steigt der Widerstand vom Material.

$$as$$
 (14)

2 Auswertung

2.1 Das röntgenmetrische Verfahren

$$n\lambda = 2d_{hkl}\sin(\phi) \tag{15}$$

Für ein kubisches Gitter lautet der Gitterabstand:

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \tag{16}$$

Fasst man die beiden Formeln für n=1 zusammen folgt:

$$\lambda = 2d_{hkl}\sin(\phi) \tag{17}$$

$$\lambda = \frac{2asin(\phi)}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \tag{18}$$

$$a = \frac{\lambda\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}{2sin(\phi)} \tag{19}$$

Probe 1 Mittelwert 3.746 Standardabweichung 0.004

h	k	l	Μ	ϕ	a
1	1	1	3	41.82	3.7414
2	0	0	4	48.53	3.7520
2	2	0	8	71.19	3.7464
3	1	1	11	86.04	3.7478
2	2	2	12	91.08	3.7418

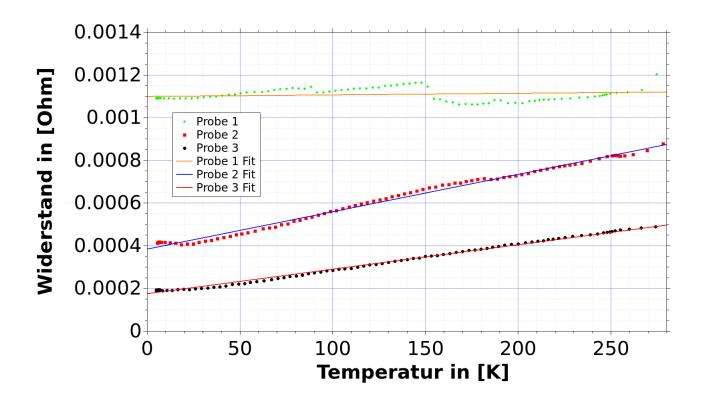
Probe 2 Mittelwert 3.756 Standardabweichung 0.008

h	k	l	Μ	ϕ	a
1	0	0	1	23.67	3.7590
1	1	0	2	33.87	3.7430
1	1	1	3	41.47	3.7716
2	0	0	4	48.37	3.7636
2	1	0	5	54.65	3.7555
2	1	1	6	60.49	3.7491
2	2	0	8	71.03	3.7537
2	2	1	9	75.87	3.7622
3	0	0	9	75.87	3.7622
3	1	0	10	80.97	3.7550
3	1	1	11	85.60	3.7633
2	2	2	12	90.82	3.7501
3	2	0	13	95.86	3.7446

Probe 3 $\begin{tabular}{ll} Mittelwert 3.744 \\ Standardabweichung 0.008 \end{tabular}$

h	k	l	Μ	ϕ	a
1	0	0	1	23.86	3.7341
1	1	0	2	34.02	3.7270
1	1	1	3	41.81	3.7423
2	0	0	4	48.51	3.7534
2	1	0	5	54.71	3.7517
2	1	1	6	60.7	3.7374
2	2	0	8	71.29	3.7418
2	2	1	9	76.26	3.7458
3	0	0	9	76.26	3.7458
3	1	0	10	81.11	3.7497
3	1	1	11	85.84	3.7548
2	2	2	12	90.85	3.7492
3	2	0	13	96.08	3.7381

2.2 Das resistive Verfahren



$$f_1(x) = 0.0799 * 10^{-6}x + 0.0010995$$

$$f_2(x) = 1.7465 * 10^{-6}x + 0.0003863$$

$$f_3(x) = 1.1439 * 10^{-6}x + 0.000177$$